

【装置名】 走査電子顕微鏡

【型 式】 JSM-IT510LA

【仕 様】

- (1) 分解能：高真空モード 3.0 nm(30kV)、15.0 nm(1.0kV)
低真空モード 4.0 nm(30kV BED)
- (2) 撮影倍率：5 倍 ～ 30 万倍
- (3) 加速電圧：0.3kV ～ 30kV
- (4) 最大試料寸法：50 mm 径 × 75 mm 高さ
- (5) 試料ステージ移動範囲：X 125 mm、Y 100 mm、Z 80 mm、傾斜 -10 ～ 90°
- (6) 画像モード：二次電子像、組成像、凹凸像、立体像、PD 像
- (7) 元素分析：エネルギー分散型 X 線分析装置（元素検出可能範囲 B ～ U）
- (8) 低真空圧力設定範囲：10 ～ 650 Pa

【用 途】 試料表面形状の高分解能観察に用いる。エネルギー分散形 X 線検出器を搭載しているため、観察と同時に元素同定を行うことができます。

【財 源】 2024 年度 機械振興補助事業（JKA 補助事業）

